

AVR3004 : 安全機能を持つQTouch

Atmel QTouch

要点

- IEC60730等級B規格の重要性
- 等級BでのAtmel[®] QTouch[®]応用
- 安全機能を検証するための検査の筋書き

概要

様々な家庭用品と白物家電、即ち。食器洗浄器、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、電磁調理器、乾燥機などで使用される電子装置の信頼性と安全な動作に対して、国際電気標準会議(IEC)はIEC60730規格を導入しました。IEC60730の等級Bソフトウェア種別は安全でない動作を防ぐソフトウェア実装が必要です。

この資料の目的はAtmel容量性接触解決策に基づくAtmel QTouchライブラリに安全機能を追加する方法を記述することです。この資料は故障状況を模倣して安全機能を検証するための検査の筋書きを提供します。提供される指針はIEC60730等級Bの必要条件に適應するためのQTouch応用の開発を使用者に許します。完全な応諾に関して使用者は必要とされるように検査を独自化することができます。

目次

1. 安全検査の概要	3
1.1. 等級B	3
1.1.1. CPUとスタックレジスタ	3
1.1.2. ウォッチドッグ機能	3
1.1.3. CPUステータスレジスタ	3
1.1.4. SRAM	3
1.1.5. 計時器機能	3
1.1.6. 割り込み機能	3
1.2. FMEA	4
1.2.1. VCCへの短絡	4
1.2.2. GNDへの短絡	4
1.2.3. 他の接触ピンへの短絡	4
1.2.4. 採取コンデンサ(Cs)短絡	4
1.2.5. 異常な信号値	4
1.3. 応用流れ図	4
1.4. 機能検査を実行するAPIの概要	5
1.5. FMEA異常状態報告	5
2. 試験の筋書き	6
2.1. 事前必要条件	6
2.2. 検査項目	6
3. 提供物	9
3.1. フォルダとファイル	9
4. QTouchプロジェクトへの安全機能移植	9
4.1. QTouchプロジェクト外作成	9
4.2. 等級BとFMEAの統合	10
5. 参照	12
6. 改訂履歴	12

1. 安全検査の概要

IEC60730に従って、単一チャンネル応用(1つのマイクロ コンピュータだけを使用する応用)は以下を実行することができるファームウェア設定を持たなければなりません。

- 始動機能検査
- 周期的機能検査

単一チャンネル機能検査は今日使用される最も一般的で実装が最も容易な機構です。機能の組が始動で検査され、いくつかの機能は周期的に検査されます。検査結果に基づき、適切な活動が取られます。

検査機能は2つの部分、即ち、等級BとFMEAに分離されます。MCUの内部的な部署を検査する機能検査は等級B検査で網羅され、I/Oレベルでの接続性を検査するQTouchに対する機能検査は故障種別と影響解析(FMEA:Failure Mode Effect Analysis)で網羅されます。一般的に、リセットが発行されるか、またはMCUに対して内部的である異常状態の間CPUはアイドルを保持されます。

1.1. 等級B

等級B検査はMCUの様々な部署/周辺機能の機能的な検査を網羅します。等級Bで網羅される検査はどの応用に対しても共通です。以下の検査はMCU機能を調べるために実行されます。

- CPUとスタックレジスタ
- ウォッチドッグ機能
- CPUステータスレジスタ
- SRAM
- 計時器機能
- 割り込み機能

以下の副項は各々の機能的な検査を記述します。検査が実行される順番は重要で、検査は上で言及されるのと同じ順で処理されなければなりません。例えば、汎用レジスタはSRAMを調べる前に調べられるべきです。また、等級Bでのどんな故障も応用での停止またはリセットのどちらかに帰着すべきです。

1.1.1. CPUとスタックレジスタ

汎用CPUレジスタのR0~R25,X,Y,Zは固着に対して検査されます。この検査は各レジスタで\$55と\$AAの値を連続的に書いて読むことによって実行されます。同様に、ポインタレジスタも固着に対して検査されます。このコードはアセンブリ言語で書かれ、主関数実行前に実行されなければなりません。

1.1.2. ウォッチドッグ機能

ウォッチドッグはリセットを発行するように形態設定され、これはリセットで監視されます。ウォッチドッグ リセット成功で検査は通過として宣言されます。

1.1.3. CPUステータスレジスタ

CPUステータスレジスタのSREGは\$55と\$AAを書いて読むことによって固着を調査されます。

1.1.4. SRAM

最初に、SRAMは\$55と\$AAを書いて読むことによって固着に対して調査されます。また、SRAM位置に対応するアドレスの補数がその位置に書かれて読み戻されます。これはアドレス エンコーダの正しい機能を保証します。その後、行進B検査が行われます。行進B検査の間、SRAMは2つの部分に分割されて各々の部分が独立して検査されます。

注: 行進B検査はAtmelの「AVR998:AVR®マイクロ コントローラでのIEC60730等級B適合への指針」で記述されます。

1.1.5. 計時器機能

最初に\$55と\$AAを書いて読むことによって計時器レジスタが固着に対して調査されます。

その後に計時器は計時器計数レジスタ値が比較レジスタ値と一致する時に割り込みフラグが設定されるように形態設定されます。特定時間後に割り込みフラグが調べられます。割り込みフラグが設定されていない場合、検査は失敗として宣言されます。

1.1.6. 割り込み機能

割り込み機能を検査するため、1つの計時器が溢れ割り込みを発行するように形態設定されてそれが監視されます。割り込みが起きなければ、検査は失敗として宣言されます。

1.2. FMEA

MCUの内部機能が正しく動くにも関わらず、ピンでの物理的な障害は接触動作での不規則な動きを導くかもしれません。これらの異常は識別されて是正処置がとられるべきです。この資料で言及されるFMEA検査はQTouch応用特定で他の応用に使用することはできません。

FMEA検査は(SNSとSNSKの両方の)接触ピンでの入出力ピンレベルの機能的な検査を網羅します。以下の検査がSNSとSNSKのピンで実行されます。

- VCCへの短絡
- GNDへの短絡
- 他の接触ピンへの短絡
- 採取コンデンサ(Cs)短絡
- 異常な信号値

以下の副項は各々のFMEA機能検査を記述します。これらの検査が実行を必要とする特定の順番はありません。

1.2.1. VCCへの短絡

全てのチャンネルのSNSとSNSKのピンはそれらがVCCに短絡されているかどうかを調査されます。特定チャンネルのSNSまたはSNSKがVCCに短絡されている場合、対応するチャンネルが欠陥として報告されます。

1.2.2. GNDへの短絡

全てのチャンネルのSNSとSNSKのピンはそれらがGNDに短絡されているかどうかを調査されます。特定チャンネルのSNSまたはSNSKがGNDに短絡されている場合、対応するチャンネルが欠陥として報告されます。

1.2.3. 他の接触ピンへの短絡

この検査に於いて、接触ピンはそれらが同じポートからの他の接触ピンに短絡されていないかどうかを調査されます。2つの接触ピンが短絡されている場合、両方の接触ピンに対応するチャンネルが欠陥として報告されます。

1.2.4. 採取コンデンサ(Cs)短絡

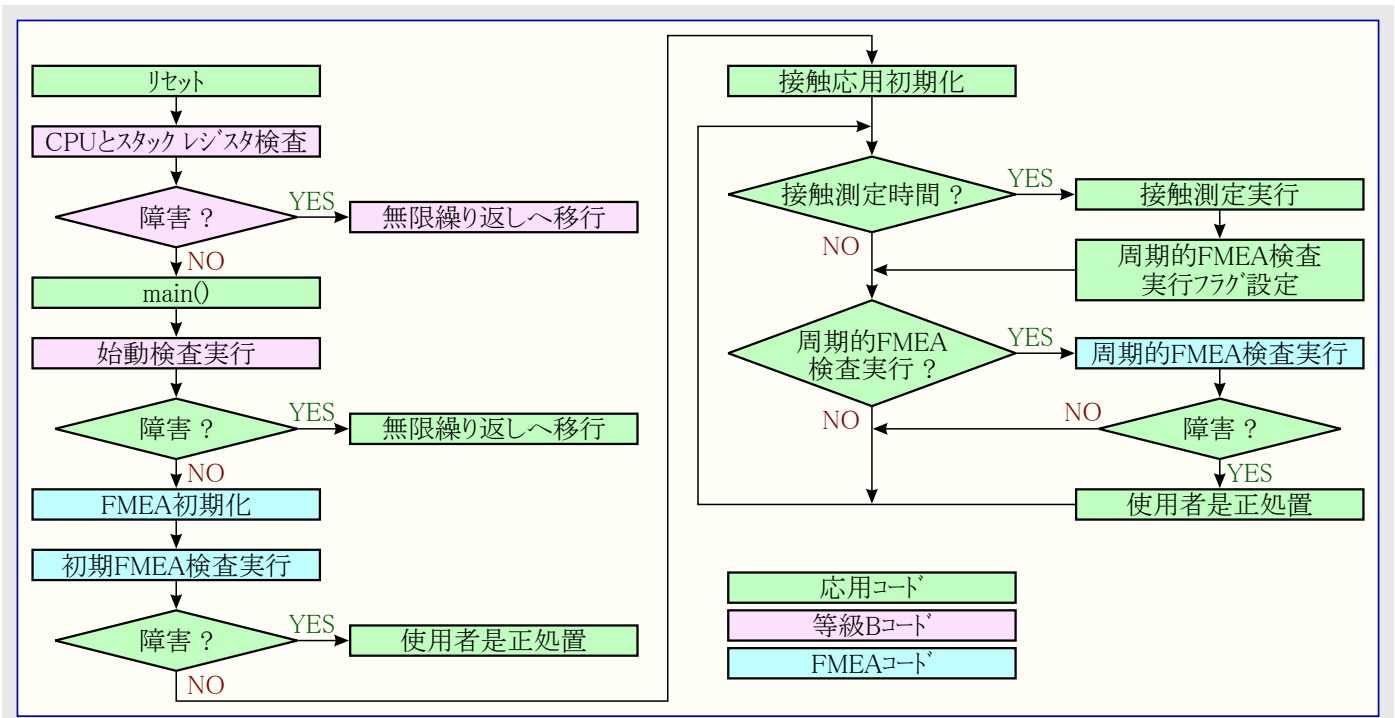
全てのチャンネルの採取コンデンサが短絡に関して調べられます。採取コンデンサが短絡されている場合は対応するチャンネルが欠陥として報告されます。内部ポート形態設定に於いて、Cs短絡は「採取コンデンサ短絡」と「他の接触ピンへの短絡」の異常として報告されるでしょう。

1.2.5. 異常な信号値

各チャンネルの信号値は予め定義された範囲で調査されます。チャンネルの信号値が範囲内でない場合はチャンネルが欠陥として報告されます。

1.3. 応用流れ図

以下の流れ図は等級BとFMEAが統合されたQTouch応用を記述します。



1.4. 機能検査を実行するAPIの概要

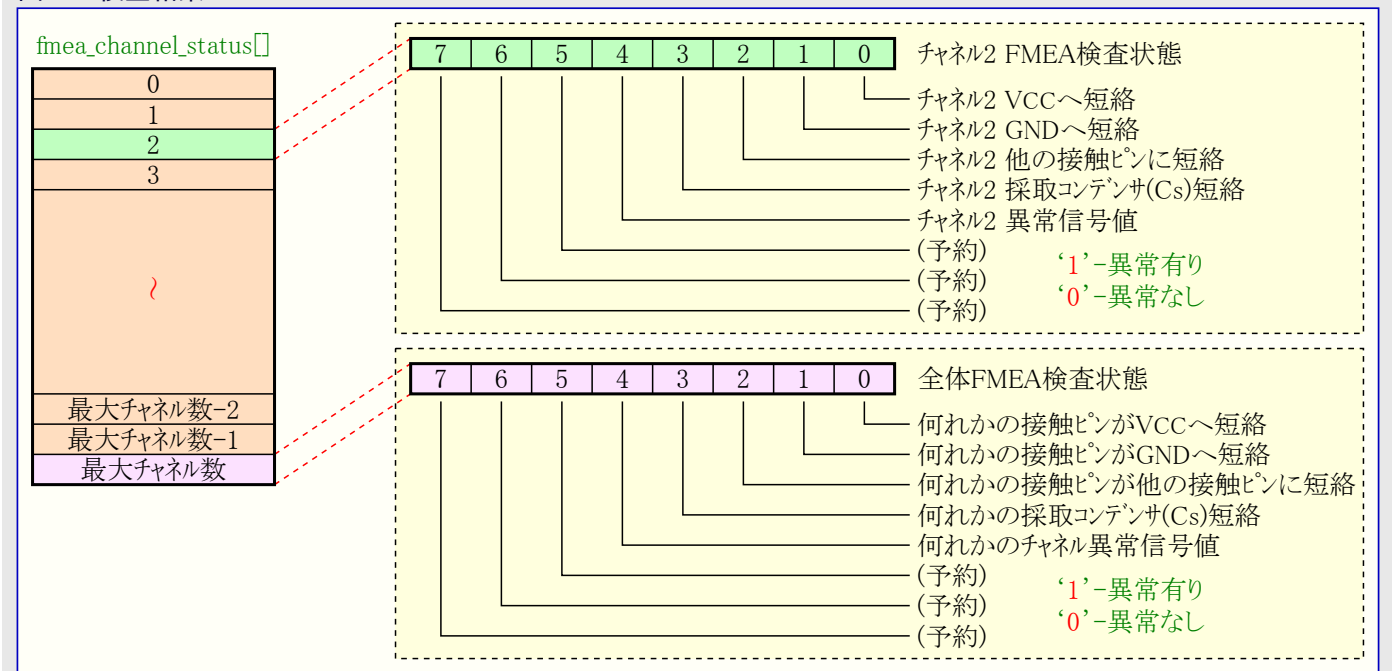
機能検査は各単位部が固有の検査を実行するように単位分割化されます。下表は重要なAPIの一覧を与えます。

API	説明
<code>void __low_level_init(void)</code>	CPUとスタックレジスタで固着化検査を実行
<code>uint8_t watchdog_test(void)</code>	ウォッチドッグ部署を形態設定してウォッチドッグ機能検査を実行
<code>uint8_t cpu_status_test(void)</code>	ステータスレジスタで固着化検査を実行
<code>uint8_t sram_test(void)</code>	SRAMで固着化と行進Bの検査を実行
<code>uint8_t timer0_test(void)</code>	計時器機能検査を実行
<code>uint8_t timer1_test(void)</code>	
<code>uint8_t timer2_test(void)</code>	
<code>uint8_t interrupt_test(void)</code>	割り込み機能を調査
<code>uint8_t startup_test(void)</code>	様々な等級B検査関数呼び出しと統合異常状態を提供
<code>void qt_fmea_init(void)</code>	FMEA検査で使用される変数とポートを初期化
<code>fmea_ret_t fmea_util_check_short_to_vcc(void)</code>	SNS/SNSKピンがVCCに短絡しているかどうかを調査
<code>fmea_ret_t fmea_util_check_short_to_vss(void)</code>	SNS/SNSKピンがGNDに短絡しているかどうかを調査
<code>fmea_ret_t fmea_util_check_short_to_pins(void)</code>	接触ピンが同じポートの他の接触ピンに短絡かどうかを調査
<code>fmea_ret_t fmea_util_check_short_cap(void)</code>	チャンネルの採取コンデンサが短絡しているかどうかを調査
<code>fmea_ret_t fmea_util_check_unusual_signal(void)</code>	チャンネルの信号値が指定された範囲を超えるかどうかを調査
<code>uint8_t qt_fmea_run_diagnostics(uint8_t select_checks)</code>	渡される入力に基づく様々なFMEA検査を実行
<code>uint8_t qt_fmea_read_error_status(uint8_t channel_num)</code>	特定チャンネルの異常状態を返す
<code>void qt_fmea_save_error_status_to_eeprom(void)</code>	FMEA異常状態をEEPROMに格納
<code>uint8_t qt_fmea_read_error_status_from_eeprom(uint8_t channel_num)</code>	EEPROMから特定チャンネルの異常状態を読み込み
<code>void perform_initial_fmea_check(void)</code>	初期FMEA検査実行と異常で使用者定義活動を講じる
<code>void perform_periodic_fmea_check(void)</code>	周期的FMEA検査実行と異常で使用者定義活動を講じる

1.5. FMEA異常状態報告

FMEA異常は幅が1バイトで深さが最大QTouchチャンネル数+1の配列(`fmea_channel_status`)で更新されます。各バイトが1つのチャンネルに対応します。配列の最後のバイトは”全体FMEA検査状態”バイトです。チャンネルでの異常は対応する1バイトと配列の最後のバイトに捕獲されます。使用者は異常状態を調べるのに配列全体を通して常に走査する必要はなく、”全体FMEA検査状態”バイトを使用することができます。チャンネルでの異常は図1-1.で示されるように更新されます。

図1-1. 検査結果



異常の例

- チャンネル0のSNS/SNSKピンがGNDに短絡している場合、第0バイトと最終バイトのビット1位置が1に設定されます。
- チャンネル3のSNS/SNSKピンがVCCに短絡している場合、第3バイトと最終バイトのビット0位置が1に設定されます。
- チャンネル2とチャンネル3のSNSピンが同じポートで短絡している場合、第2と第3のバイトと最終バイトのビット2位置が1に設定されます。
- チャンネル4のSNSとSNSKのピンがお互いに短絡していてそれらが同じポートの場合、第4バイト最終バイトのビット2と3の位置が1に設定されます。
- チャンネル5の採取コンデンサが短絡している場合、第5バイトと最終バイトのビット4位置が1に設定されます。
- チャンネル6が指定された範囲を超える信号値を持つ場合、第6バイトと最終バイトのビット5位置が1に設定されます。

2. 試験の筋書き

本章は等級BとFMEAの検査コードを試験する可能な方法を記述します。これらの試験の筋書きはAtmel ATtiny88とAtmel ATmega324Aのデバイスに向けられます。

等級B検査はMCUの様々な周辺機能で機能的な調査を実行します。これらの試験は手動で異常を導入することによって検査することができ、デバッグ動作で例のプロジェクトを実行することによって実行されることが必要です。

等級Bと異なり、FMEA検査はMCUの入出力で実行されます。故に、使用者は容易に異常を模倣してFMEA検査の機能性を調べることができます。これらの検査項目は全てのデバイスに対して共通です。使用者は監視(Watch)ウィンドウを通して結果(`fmea_channel_status`配列)を見るか、またはPCでそれらを見るためにUARTを通して配列を送信することができます。

2.1. 事前必要条件

- 検査を実行するためのハードウェア基盤
- デバッグツール (Atmel AVR JTAGICE mkII、JTAGICE3、またはAVR ONE!)
- Atmel Studio 6でのデバッグと監視ウィンドウの知識
- 例プロジェクトの構築とデバイス内への書き込み

2.2. 検査項目

下表は様々な検査項目と期待する結果を記述します。使用者は検査1～5を実行するためにデバッグ動作で例プロジェクトを走行することが必要です。残りの検査はデバッグ動作またはデバイス書き込み後のどちらでも実行することができます。現在の検査のために含まれた追加コードも次の検査項目を走行する前に取り去られるべきです。

SI番号	検査概要	検査実行手順	期待する結果
1	ウォッチドッグ検査	<p>異常なし状態</p> <ul style="list-style-type: none"> - PD0を出力として汎用入出力を形態設定します。 - <code>main.c</code>で<code>startup_test()</code>を呼ぶ前にピンをLowにします。 - <code>startup_test()</code>を呼んだ後にピンをHighにします。 - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - 応用を走らせます(F5)。 <p>異常状態模倣</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - <code>watchdog_test()</code>で<code>while(1)</code>文に中断点(ブレークポイント)を置きます。 - 応用を走らせます(F5)。 - 監視ウィンドウを通して<code>WDTCSR</code>の値を0に変更します。これはウォッチドッグ単位部がリセット発行に形態設定されないことを保証します。 	<p>異常なし状態</p> <p>PD0がHighであるべきです。</p> <p>異常状態</p> <p>PD0がLowであるべきです。</p>
2	CPUステータスレジスタ検査	<p>異常なし状態</p> <ul style="list-style-type: none"> - PD0とPD1を出力として汎用入出力を形態設定します。 - <code>startup_test()</code>を呼ぶ前に両ピンをLowにします。 - <code>startup_test()</code>を呼んだ後にPD0ピンをHighにします。 - <code>qt_fmea_init()</code>を呼ぶ前にPD1ピンをHighにします。 - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - 応用を走らせます(F5)。 <p>異常状態模倣</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - <code>cpu_status_test()</code>で<code>"a=SREG;"</code>に中断点を置きます。 - 監視ウィンドウを通して<code>SREG</code>の値を0に変更します。これは不正値読み込みに帰着し、検査異常を導きます。 - 応用を走らせます(F5)。 	<p>異常なし状態</p> <p>PD0とPD1がHighであるべきです。</p> <p>異常状態</p> <p>PD0がHigh、PD1がLowであるべきです。</p>

次頁へ続く

SI番号	検査概要	検査実行手順	期待する結果
3	SRAM検査	<p>異常なし状態 ”CPUステータスレジスタ検査”と同様に”異常なし状態”検査を実行します。</p> <p>異常状態模倣 - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - <code>sram_test()</code>で”for”の何処かに中断点を置きます。 - 応用を走らせます(F5)。 - 現在検査中のSRAM位置の値を無作為な値に変更します。これはSRAM検査を失敗させます。 - 応用を走らせます(F5)。</p>	<p>異常なし状態 PD0とPD1がHighであるべきです。</p> <p>異常状態 PD0がHigh、PD1がLowであるべきです。</p>
4	計時器0検査 計時器1検査 計時器2検査 ”計時器2検査”はATmega324Aデバイスに対してだけ利用可能です。	<p>異常なし状態 ”CPUステータスレジスタ検査”と同様に”異常なし状態”検査を実行します。</p> <p>異常状態模倣 - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - <code>timer0_test()</code>で”i=0”文に中断点を置きます。 - 応用を走らせます(F5)。 - 監視ウィンドウを通して”TCCRnA/B”の値を0に変更します。ATtiny88については”TCCR0A”、ATmega324Aについては”TCCR0B”。 - 応用を走らせます(F5)。</p> <p>計時器1と計時器2で同様に検査を実行します。</p>	<p>異常なし状態 PD0とPD1がHighであるべきです。</p> <p>異常状態 PD0がHigh、PD1がLowであるべきです。</p> <p>計時器1と計時器2に対する異常状態は同じです。</p>
5	割り込み検査	<p>異常なし状態 ”CPUステータスレジスタ検査”と同様に”異常なし状態”検査を実行します。</p> <p>異常状態模倣 - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - <code>interrupt_test()</code>で”TCNT0=254”文に中断点を置きます。 - 応用を走らせます(F5)。 - 監視ウィンドウを通してTIMSK0の値を変更します。 - 応用を走らせます(F5)。</p>	<p>異常なし状態 PD0とPD1がHighであるべきです。</p> <p>異常状態 PD0がHigh、PD1がLowであるべきです。</p>
6	VCCへ短絡	<p>異常なし状態 - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - 応用を走らせます(F5)。</p> <p>異常状態模倣 - <code>qt_fimea_init()</code>の後に以下のコードを追加します。 <code>while(1)</code> <code>fimea_util_check_short_to_vcc();</code> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - <code>fimea_util_check_short_to_vcc()</code>に中断点を置きます。 - チャネル”N”のSNSかSNSKのどちらかをVCCに接続し、応用を走らせます(F5)。 - 同様に他のチャンネルのSNSかSNSKのピンをVCCに接続し、応用を走らせます。</p>	<p>異常なし状態 <code>fimea_channel_status</code>配列の全領域が\$00であるべきです。</p> <p>異常状態 <code>fimea_channel_status[N]</code>と<code>fimea_channel_status</code>配列の最終バイトのビット0が1に設定されるべきです。</p> <p>他のチャンネル調査中、配列の各々のバイトが調査されるべきです。</p>

[次頁へ続く](#)

SI番号	検査概要	検査実行手順	期待する結果
7	GNDへ短絡	<p>異常なし状態</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - 応用を走らせます(F5)。 <p>異常状態模倣</p> <ul style="list-style-type: none"> - qt_fmea_init()の後に以下のコードを追加します。 <pre>while(1) fmea_util_check_short_to_vss();</pre> <ul style="list-style-type: none"> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - fmea_util_check_short_to_vss()に中断点を置きます。 - チャネル”N”のSNSかSNSKのどちらかをGNDに接続し、応用を走らせます(F5)。 - 同様に他のチャネルのSNSかSNSKのピンをGNDに接続し、応用を走らせます。 	<p>異常なし状態</p> <p>fmea_channel_status配列の全領域が\$00であるべきです。</p> <p>異常状態</p> <p>fmea_channel_status[N]とfmea_channel_status配列の最終バイトのビット1が1に設定されるべきです。</p> <p>他のチャネル調査中、配列の各々のバイトが調査されるべきです。</p>
8	他の接触ピンへの短絡 注: ポートを渡って短絡される接触ピンはこの検査で調べられません。	<p>異常なし状態</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - 応用を走らせます(F5)。 <p>異常状態模倣</p> <ul style="list-style-type: none"> - qt_fmea_init()の後に以下のコードを追加します。 <pre>while(1) fmea_util_check_short_to_pins();</pre> <ul style="list-style-type: none"> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - fmea_util_check_short_to_pins()に中断点を置きます。 - チャネル”N”の接触ピンとチャネル”M”の接触ピンを接続し、応用を走らせます(F5)。 - 同様に他のチャネルを調べます。 	<p>異常なし状態</p> <p>fmea_channel_status配列の全領域が\$00であるべきです。</p> <p>異常状態</p> <p>fmea_channel_status[N]とfmea_channel_status[M]とfmea_channel_status配列の最終バイトのビット2が1に設定されるべきです。</p> <p>他のチャネル調査中、配列の各々のバイトが調査されるべきです。</p>
9	採取コンデンサ(Cs)短絡	<p>異常なし状態</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - 応用を走らせます(F5)。 <p>異常状態模倣</p> <ul style="list-style-type: none"> - qt_fmea_init()の後に以下のコードを追加します。 <pre>while(1) fmea_util_check_short_cap();</pre> <ul style="list-style-type: none"> - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - fmea_util_check_short_to_cap()に中断点を置きます。 - チャネルNの採取コンデンサを短絡し、応用を走らせます(F5)。 - 同様に他のチャネルを調べます。 	<p>異常なし状態</p> <p>fmea_channel_status配列の全領域が\$00であるべきです。</p> <p>異常状態</p> <p>fmea_channel_status[N]とfmea_channel_status配列の最終バイトのビット3が1に設定されるべきです。</p> <p>注: 感知部が内部ポートとして形態設定される場合、ビット位置2も設定されます。</p>
10	異常信号値	<p>異常なし状態</p> <ul style="list-style-type: none"> - FMEA_UNUSUAL_SIG_VAL_HIGHとFMEA_UNUSUAL_SIG_VAL_LOWに正しい値を設定します。 - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - 応用を走らせます(F5)。 <p>異常状態模倣</p> <ul style="list-style-type: none"> - 信号値が指定された範囲を超えられるようにチャネル”N”の採取コンデンサを変更します。 - (Alt+F5)押下によってデバッグを開始します。 - qt_fmea_perform_periodic_check()に中断点を置きます。 - 応用を走らせます(F5)。 	<p>異常なし状態</p> <p>fmea_channel_status配列の全領域が\$00であるべきです。</p> <p>異常状態</p> <p>fmea_channel_status[N]とfmea_channel_status配列の最終バイトのビット4が1に設定されるべきです。</p> <p>他のチャネル調査中、配列の各々のバイトが調査されるべきです。</p>

3. 提供物

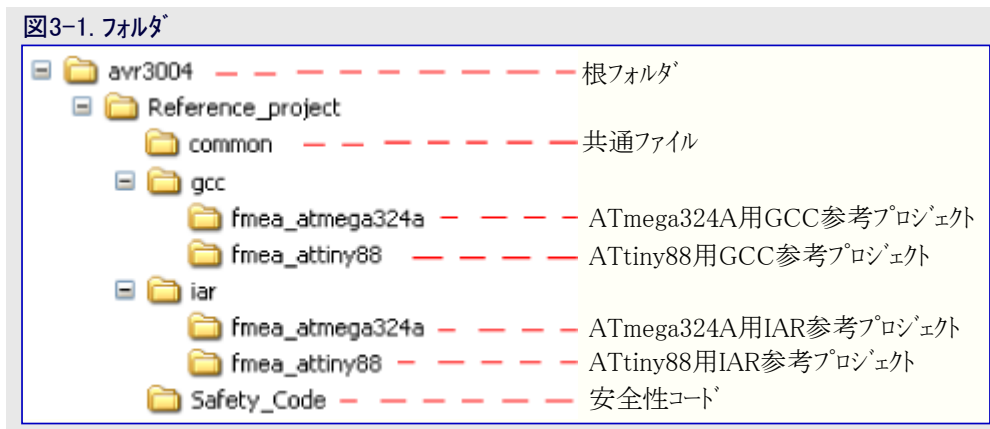
QTouchプロジェクトの例がそれらに追加される安全機能と共に提供されます。例プロジェクトはAtmel ATmega324AとAtmel ATtiny88のデバイス用に提供されます。使用者は他のAtmel tinyAVR®とmegaAVR®のデバイスに対して安全機能を許可するために”ClassB.c”ファイル内の検査関数を容易に変更することができます。”qfmea.c”と”qfmea.h”のファイルはAtmel tinyAVRとmegaAVRのどのデバイスに対しても共通で、GCCとIAR™のコンパイラ用に独立して提供されますが、これらは機能的に同じです。

注: 検査コードまたは参照プロジェクトは検査異常でのどんな是正コードも持ちません。使用者は4.章で言及されるように各々の場所には是正コードを追加することが必要です。

注: FEMAコードは更なるアクセスのためにEEPROM内にFMEA異常状態配列を格納します。QDebug規約もEEPROMを使用します。故に、同時に1つの機能だけが許可される、またはそれらが独立したEEPROMメモリ空間を使用するように注意が払われるべきです。

3.1. フォルダとファイル

図3-1.はフォルダの詳細を提供します。



以下のファイルは”Safety_Code”フォルダで利用可能です。

ファイル名	説明
low_level_init.c	CPUとスタックレジスタの検査用の実装を含みます。
ClassB.c	MCUの内部単位部/周辺機能(ウォッチドッグ、割り込み、SRAM、CPUステータスレジスタ、計時器)用検査を含みます。
ClassB.h	関数原型宣言とマクロ定義を含みます。
qfmea.c	FMEA検査の実装を含みます。
qfmea.h	FMEA検査の関数原型宣言、全体変数宣言、マクロ定義を含みます。

4. QTouchプロジェクトへの安全機能移植

Atmel ATmega324AとAtmel ATtiny88のデバイス用に例プロジェクトが提供されるとは言え、安全コードは小さな努力で様々なAtmel tinyAVRやmegaAVRのデバイスに移植することができます。以下の副項はQTouch応用に等級BとFMEAのコードを移植する手順を提供します。

4.1. QTouchプロジェクト作成

- QTouchライブラリ 5.0または最終版をダウンロードしてインストールしてください。
- 適切なライブラリと選択したデバイス用の例プロジェクトを選ぶためにLibrary_Selection_Guide.xlsを参照してください。
- インストールされた次の場所を参照してください。例プロジェクトをアクセスするには、
”..¥Atmel¥Atmel_QTouch_Libraries_5.0¥Generic_QTouch_Libraries¥AVR_Tiny_Mega_XMega¥QTouch¥example_projects”
- ”Atmel Studio 6”または”IAR Embedded Workbench®”で例プロジェクトを開いてください。
- 必要条件によって”touch_config.h”でパラメータを形態設定してください。パラメータのより多くの詳細については「ライブラリ使用者の手引き」を参照してください。
- コードを構築して書き込んでください。
- Atmel QT600とQTouch分析器の手助けで接触動作が正しい機能であることを確認してください。

4.2. 等級BとFMEAの統合

- “..¥Safety_Code”から全ファイルをプロジェクト フォルダへ複製してください。
- “qfmea.c”、“ClassB.c”、“low_level_init.c”のファイルをプロジェクトに追加してください。
- 選択したデバイスに基づいて“ClassB.c”で変更を行ってください。
- main.cで、「#include “touch_api.h”」後に右のコードを含めてください。

```
/* now include touch api.h with the localization
#include "touch_api.h"

#ifdef _FMEA_
/* include classb and fmea header files */
#include "qfmea.h"
#include "classb.h"
#endif
```

- main.cで、「static void config_sensor(void);」後に右のコードを含めてください。

```
static void config_sensors(void);

#ifdef _FMEA_
/* perform initial fmea test */
void perform_initial_fmea_check(void);
/* perform periodic fmea test */
void perform_periodic_fmea_check(void);

/* fmea error status array */
extern uint8_t fmea_channel_status[FMEA_REPORT_SIZE];
/* fmea config structure */
extern qt_fmea_config_t qt_fmea_config;
#endif

#if defined(_ROTOR_SLIDER_)
```

- main.cで、「uint16_t burst_flag = 0u;」後に右の変数定義を含めてください。

```
uint16_t burst_flag = 0u;

#ifdef _FMEA_
/*Declare ClassB and FMEA related variables */
uint8_t test_status = 0;
uint8_t time_to_check_signal_value = 0;
#endif
```

- main.cで、「uint8_t time_to_check_signal_value = 0;」後に等級B始動検査を呼び出して調べるために右のコードを含めてください。

```
/* watchdog, timer0, timer1, interrupt, RAM test */
test_status = startup_test();
/* reset watchdog timer */
asm("wdr");

if(test_status != 1)
{
/* Startup test failed */
while(1);
}
```

- init_timer_isr()を呼ぶ前に右のコードを追加してください。

```
asm("wdc");

#ifdef _FMEA_

/* Assign EEPROM address to updated FMEA error status */
qt_fmea_config.eeprom_start_address = 0x100;
/* signal values which are beyond this range will be reported as error */
qt_fmea_config.hi_signal_threshold = 90;
qt_fmea_config.lo_signal_threshold = 30;

#endif

/* configure timer ISR to fire regularly */
```

- 右で示されるようにEEPROMアドレスを割り当てた後に右のFMEA初期化コードを追加してください。

```
qt_fmea_config.lo_signal_threshold = 30;

/* initialize fmea test */
qt_fmea_init();
/* reset watchdog timer */
asm("wdc");

#endif
```

- main.cで、qt_fmea_init()関数後に右のコードを含めることによって初期FMEA検査を走らせてください。

```
qt_fmea_init();
/* reset watchdog timer */
asm("wdc");

/* perform initial fmea tests and take corrective actions */
perform_initial_fmea_check();
/* reset watchdog timer */
asm("wdc");

#endif
```

- main.cで、startup_test(), qt_fmea_init(), qt_fmea_run_initial_test(), init_system(), config_sensors(), qt_init_sensing(), QDebug_ProcessCommands()関数呼び出し後に右のウォッチドッグ リセット コードを追加してください。「/* 時間が重要なホスト応用コードをここで実行 */」の後にも追加してください。

```
/* initialise host app, pins, watchdog, etc */
init_system();
/* reset watchdog timer */
asm("wdc");
```

- 「time_to_measure_touch = 0u;」後に右のコードを追加してください。

```
time_to_measure_touch = 0u;
/* reset watchdog timer */
asm("wdc");

#ifdef _FMEA_
time_to_check_signal_value = 1;
#endif
```

- 「/* 時間が重要でないホスト応用コードをここで実行 */」の後に右のコードを追加してください。

```
/* Time Non-critical host application code goes here */
#ifdef _FMEA_
if(time_to_check_signal_value == 1)
{
time_to_check_signal_value = 0;
/* perform periodic fmea tests and take corrective actions */
perform_periodic_fmea_check();
}
#endif
```

- 例プロジェクトからperform_initial_fmea_check()とperform_periodic_fmea_check()関数の定義を複製してmain.cの最後に同じ物を追加してください。
- main.cファイルで以下の変数に以下の正しい値が設定されることを確実にしてください。
 - qt_fmea_config.hi_signal_threshold : これよりも小さな信号値は”qt_fmea_run_diagnostics”関数で失敗として宣言されるでしょう。
 - qt_fmea_config.lo_signal_threshold : これよりも大きな信号値は”qt_fmea_run_diagnostics”関数で失敗として宣言されるでしょう。
 - qt_fmea_config.eeprom_start_address : EEPROMに格納されるFMEA異常状態の開始アドレス。
- main.cで以下の場所に是正コードを含めてください。
 - /* 接触ピンVCCに短絡異常 */
 - /* 接触ピンVSS(GND)に短絡異常 */
 - /* 接触ピン他の接触ピンに短絡異常 */
 - /* Cs短絡異常 */
 - /* 異常信号異常 */

5. 参照

- Atmel AVR998:AVRマイクロ コントローラでのIEC60730等級B適合への指針
- Atmel AVR1610:XMEGAでのIEC60730等級B適合への指針
- QTAN0079:鈕、摺動子、輪の感知部設計の手引き
- Atmel QTouchライブラリ使用者の手引き

6. 改訂履歴

資料改訂	日付	注釈
42041A	2012年11月	初版資料公開



Enabling Unlimited Possibilities®

Atmel Corporation

1600 Technology Drive
San Jose, CA 95110
USA
TEL (+1)(408) 441-0311
FAX (+1)(408) 487-2600
www.atmel.com

Atmel Asia Limited

Unit 01-5 & 16, 19F
BEA Tower, Millennium City 5
418 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG
TEL (+852) 2245-6100
FAX (+852) 2722-1369

Atmel Munich GmbH

Business Campus
Parking 4
D-85748 Garching b. Munich
GERMANY
TEL (+49) 89-31970-0
FAX (+49) 89-3194621

Atmel Japan G.K.

141-0032 東京都品川区
大崎1-6-4
新大崎勸業ビル 16F
アトメル ジャパン合同会社
TEL (+81)(3)-6417-0300
FAX (+81)(3)-6417-0370

© 2012 Atmel Corporation. 全権利予約済 / 改訂:42041A-AVR-11/2012

Atmel®、ロゴとそれらの組み合わせ、AVR®、Enabling Unlimited Possibilities®、megaAVR®、QTouch®、tinyAVR®、XMEGA®とその他はAtmel Corporationの登録商標または商標またはその付属物です。他の用語と製品名は一般的に他の商標です。

お断り: 本資料内の情報はAtmel製品と関連して提供されています。本資料またはAtmel製品の販売と関連して承諾される何れの知的所有権も禁反言あるいはその逆によって明示的または暗示的に承諾されるものではありません。Atmelのウェブサイトに表示する販売の条件とAtmelの定義での詳しい説明を除いて、商品性、特定目的に関する適合性、または適法性の暗黙保証に制限せず、Atmelはそれらを含むその製品に関連する暗示的、明示的または法令による如何なる保証も否認し、何ら責任がないと認識します。たとえばAtmelがそのような損害賠償の可能性を進言されたとしても、本資料を使用できない、または使用以外で発生する(情報の損失、事業中断、または利益と損失に関する制限なしの損害賠償を含み)直接、間接、必然、偶然、特別、または付随して起こる如何なる損害賠償に対しても決してAtmelに責任がないでしょう。Atmelは本資料の内容の正確さまたは完全性に関して断言または保証を行わず、予告なしでいつでも製品内容と仕様の変更を行う権利を保留します。Atmelはここに含まれた情報を更新することに対してどんな公約も行いません。特に別の方法で提供されなければ、Atmel製品は車載応用に対して適当ではなく、使用されるべきではありません。Atmel製品は延命または生命維持を意図した応用での部品としての使用に対して意図、認定、または保証されません。

© HERO 2016.

本応用記述はAtmelのAVR3004応用記述(Rev.42041A-11/2012)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意識されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。